

2014年4月8日(星期二)

现场报名于2014年4月7日开启

09:30 - 10:40	致欢迎辞：全体会议嘉宾 2014年名誉主席、北京邮电大学宋俊德教授； 北京无线电计量测试研究所所长冯克明； 浙江大学射频与纳米电子研究中心主任李尔平首席教授； Agilent Technologies 公司市场营销经理 Mario Narduzzi				
10:40 - 10:50	EDICON 展览预览				
10:50 - 12:00	行业主题演讲：以5G蜂窝挑战为特色 中国移动研究院研发总监 Corbett Rowell； 中兴通讯营销总监邓杰； National Instruments 公司营销总监 James Kimery； Rohde & Schwarz 公司频谱/网络 ANA 和 EMC 总监 Josef Wolf				
12:00 - 13:30	代表和贵宾午餐				
技术会议					
	TU101 ; A 厅	TU102 ; B 厅	TU103 ; C 厅	TU104 ; D 厅	TU105 ; E 厅
13:30 - 13:50	放大器测试：包络跟踪技术 Frank-Werner Thuemmler, Rohde & Schwarz	混合谐波负载牵引阻抗合成算法 Xianfu Sun, Focus Microwaves	动态频率选择的测量要求 Xiang Feng, Agilent Technologies	空中测量的预选和修平滤波器的影响 Brian Avenell, National Instruments	针对下一代蜂窝无线基础设施的 MMIC 低噪声放大器 Loo Kah Cheng, Mini-Circuits
13:50 - 14:10	应对包络跟踪测试解决方案的同步挑战 David Hall, National Instruments	宽带和超高速器件表征的混合信号有源谐波负载牵引 Mauro Marchetti, Anteverta Microwaves	实时扩展至 160 MHz 的监测跳频信号和针对研发应用的强大频谱分析工具 Wolfgang Wendler, Rohde & Schwarz	针对多天线相控阵列应用的基于数字化仪量的相位相干测量 Zhiyin Yun, Agilent Technologies	针对高度集成应用的新 ED-PHEMT 技术 Cheng-Kuo Lin, WIN Semiconductors
研讨会					
	WS_TU101	WS_TU102	WS_TU103	WS_TU104	WS_TU105
14:15 - 15:00	数字系统的信号完整性测量技术 Deng-Liang Sun, Agilent Technologies；用于表征 28 Gb/s SERDES 通道的先进技术 Robert Sleigh, Agilent Technologies	设计阶段功率放大器的准确和有效测量 Hongwen Yang, Rohde & Schwarz	NI DPD 研讨会：移动 PA 测试的数字预失真技术 James Kimery, National Instruments	Spirent 研讨会：MIMO OTA 通道验证 Hui Xiao, Spirent	CETC 41 研讨会：复杂电磁信号测试与分析技术 Wang Feng, CETC 41
15:00 - 15:30	咖啡 / 茶歇				
	WS_TU201	WS_TU202	WS_TU203	WS_TU204	
15:30 - 16:15	Freescale 研讨会：通过灵活的 RF 设计实现 TD-LTE 部署 Eric Westberg, Freescale Semiconductor	Anritsu 研讨会：110 GHz 及以上稳定晶圆上宽带器件的表征 Bob Buxton, Anritsu	Mini-Circuits 研讨会：针对射频产品和系统认证的便携式和生产测试设备 Chi Man Shum, Mini-Circuits	CST 研讨会：MIMO 天线系统仿真 Cier Siang Chua, CST	
	WS_TU301	WS_TU302	WS_TU303	WS_TU304	
16:15 - 17:00	MACOM 研讨会：打破千瓦 GaN 界限 Damian McCann, MACOM	Maury 研讨会：矢量接收机负载牵引 Dong-Liang Yang, Maury Microwave	NI 研讨会：现代无线标准的无线发射器指标调查，David Hall, National Instruments；以及现代无线标准的无线接收器指标调查 David Hall, National Instruments	EMSS 研讨会：板级噪声耦合和 LTE MIMO 天线设计 Peter, Futter, EMSS Workshop	
17:00 - 18:00	酒会及贵宾晚宴				
18:00 - 21:00					

新闻发布
研讨会
(12:30
开始)
记者展览
参观将在
13:00 开始

展览
时间
(12:30
-
17:00)

在即将印刷时，这个会议的详细信息是正确的。这些信息可能随时更改。
最新信息请访问我们的网站 www.ediconchina.com。

2014年4月9日(星期三)

	设计环节： A厅	测量和建模环节： B厅	系统级测量/建模： C厅	系统工程环节： D厅	商业资源环节： E厅	
	WE101	WE102	WE103	WE104	WE105	
08:30 - 08:50	针对 4GS/s 6 位 ADC 的 InGaP/GaAs HBT 比较器 Jincan Zhang, 西安电子科技大学	自动夹具去除技术的演变 Ning Cheng, Agilent Technologies	A-GPS OTA 测试方法 Ron Borsato, Spirent	基于 FPGA 的 DiSEqC 发生器和分析仪系统 Jian Xu, Qualcomm	针对带状线功率分配器谐波抑制的金属圆柱腔 Huan-Huan Xie, 西安导航技术研究所	
08:50 - 09:10	采用注入频率分频电路的 21.6 GHz 频段低功率锁相环芯片设计 Wen Cheng Lai, 国立台湾科技大学	现代宽带接收机的新校准要求 Chunlan Qin, Agilent Technologies	区分好/坏 2x2 IMO 天线系统的基于电波暗室的 MIMO OTA Lars Foged, Microwave Vision Group	全球导航卫星系统及其广泛应用 Frank-Werner Thuemmler, Rohde & Schwarz	高频 PCB 设计与分析:跨平台流程/解决方案 Milton Lien, AWR	
09:15 - 09:35	利用混合波形工程设计高效率的高压 GaN HEMT Doherty 功率放大器 Zhancang Wang, Nokia Solutions & Networks	使用集成 EM 和电路设计仿真软件优化芯片-模块-板转换 John Dunn, AWR	针对 MIMO 吞吐量测试公开化的辐射二步法 Yangguang Xu, Tri-L	在轨卫星的群延迟测量 Thilo Bednorz, Rohde & Schwarz	高速度和高功率连接器设计 Klaus Krohne, CST	
09:35 - 09:55	利用谐波处理的高压 GaN HEMT 反向 Doherty 功率放大器 Zhancang Wang, Nokia Solutions & Networks	3D 射频系统仿真的演变 Rickard Petersson, ANSYS	针对 MIMO 器件性能评估的辐射二步 OTA 测试方法 Ya Jing, Agilent Technologies	卫星频率上变频器的表征 Thilo Bednorz, Rohde & Schwarz	不断创新满足信号互连的复杂要求 Robert Shen, Emerson	
10:00 - 10:30	咖啡 / 茶歇					
		WE202	WE203	WE204	WE205	
10:35 - 10:55	针对无线基础设施发射机应用的高功率、多频带 Doherty 放大器 Jarod Geng, Freescale Semiconductor	GaN 基高电子迁移率晶体建模方法的选择 Qiang Chen, Agilent Technologies	利用频谱分析仪和外部谐波混频测量 E 波段的无线电链路 Wolfgang Wendler, Rohde & Schwarz	大规模 MIMO 原型设计 James Kimery, National Instruments	高频率条件下的温度可变衰减器性能 Moamer Hasanovic, EMC/Florida RF Labs	
10:55 - 11:15	采用简化实频技术的宽带功率放大器设计, Qin Shen-Schultz, Agilent Technologies	微波电路的稳定性分析, Stephane Dellier, AMCAD	针对成本有效的毫米波测量的测试模块和乘法器, Kent Whitney, Millitech	了解蓝牙低能量及其测试, Yvonne Liu, Agilent Technologies	基于金刚石的氮化镓:下一个 GaN, Justin Saeheng, Element 6	展览时间 (10:00 - 17:00)
11:20 - 11:40	针对高功率应用的宽带线性化技术, Qin Shen-Schultz, Auriga	DPD 模型的性能比较和复杂性降低, Tong Li, Agilent Technologies	毫米波范围宽带信号的生成和分析, Zhigang Ma, Rohde & Schwarz	改进雷达系统的现代测量方法, Feng Chen, Rohde & Schwarz	针对高频应用的印刷电路板材料, Art Aguayo, Rogers Corp.	
11:40 - 12:00	优选线性测量, Chris Chiccone, National Instruments	针对 PA 设计包络跟踪技术的综合仿真流程, Xindong Xue, Agilent Technologies	用于无线系统设计的 RFP™ 频率规划综合工具, Peter Xu, AWR	用于雷达设计的 NI-AWR 集成框架, Gent Paparisto, AWR/National Instruments	作为生产测试部分的 RF PCB 认证, Josef Koeppel, Rohde & Schwarz	
12:00 - 13:30	午餐休息					

论坛和研讨会						展览时间 (10:00 - 17:00)
PA_WE101	WS_WE102	WS_WE103	WS_WE104	WS_WE105		
13:30 - 14:15	GaN 分组会议： 参与：MACOM、Freescale、TriQuint、Microsemi、Nitronex 赞助；Richardson RFPD 主持：Pat Hindle，微波杂志	Peregrine 研讨会： UltraCMOS 的崛起解决了棘手的 RF 挑战，与 GaN 相辅相成 Jack Lu, Peregrine Semiconductor	信号监测及频谱分析研讨会： 利用矢量信号分析扩展实时频谱分析应用， Qin Zhang, Agilent Technologies; 利用 FPGA 的 MUSIC 算法实现瞬态信号监测 Huimin Shi, Agilent Technologies	CST 研讨会： 仿真和测量：辅助设计工具 Klaus Krohne, CST	LeCroy 研讨会	
WE201	WE202	WE203	WE204	WE205		
14:15 - 15:00	RFHIC 研讨会： 针对电信市场的 GaN 晶体管解决方案， JaeHo Lee, RFHIC， 针对小蜂窝应用的高效率 GaN 混合放大器 JaeHo Lee, RFHIC	OMMIC 研讨会： 针对毫米波应用的 100 nm GaN/ 硅技术 Marc Rocchi, ERA/ OMMIC	Richardson RFPD 研讨会： 小蜂窝 Jason Su, Richardson RFPD	AWR 研讨会： 用 Microwave Office 软件实现参考设计， Francis Leong, AWR, NI-AWR WLAN 802.11ac 的集成框架 Gent Paporisto, AWR/ National Instruments	MIMO OTA 研讨会： 针对单个集群 MIMO 的 OTA 测试 Yulong Tang, ETS-Lindgren；推动亚太地区的 OTA 标准 Guo Lin, ETS-Lindgren	
15:00 - 15:30	咖啡 / 茶歇					
WS_WE301	WS_WE302	PA_WE303	WS_WE304	WS_WE305		
15:30 - 16:15	GaN PA 设计研讨会： 第 1 部分 本征 Cree GaN HEMT 模型允许更精确波形设计的 PA 设计 Ray Pengelly, Cree	Mitron 研讨会： 如何基于应用选择电缆组件 Wei Liu, Mitron	MIMO OTA 测试分组会议： MIMO OTA 推动工业测试和标准 由 Spirent 赞助	ANSYS 研讨会： 有源阵列天线的 CAE 仿真 Haiqiang Ding, ANSYS	Rohde & Schwarz 研讨会： VoLTE Video Over LTE 的测试 Rohde & Schwarz	
WS_WE401	WS_WE402	WS_WE403	WS_WE404	WS_WE405		
16:15 - 17:00	GaN PA 设计研讨会： 第 2 部分 采用 AWR Microwave Office 软件和 CREE 技术设计 F 类功率放大器 John Dunn, AWR	Agilent 研讨会： 利用可自定义模块化仪器和系统设计工具实现快速原型设计 Yu Zuo, Agilent Technologies	COMSOL 研讨会： 通过物理仿真打造新兴射频技术 Jiyoun Munn, COMSOL	WLAN 生产测试研讨会： 用多 DUT 测试提高 WLAN 制造测试吞吐量 Erik Johnson, National Instruments	Taconic 研讨会： 柔性印刷电路材料在医疗环境中的应用 Wingkin Li, Taconic	

2014 年 4 月 10 日 (星期四)						
	设计环节： A 厅	RF/MW 测量 / 建模环节： B 厅	EMC/EMI 和 HSD 测量 / 建模环节： C 厅	系统工程环节： D 厅	商业 资源环节： E 厅	
	TH101	TH102	TH103	TH104	TH105	
08:30 - 08:50	宽带圆极化微带天线生产 Huang Shanshan, 南京理工大学光学与电子工程学院	采用被动噪声标准的噪声参数系统验证 Aihua Wu, 河北半导体研究所	ATE 的相位噪声和抖动测试测量中 RF 固态开关的影响 Yean Feng Chek, Texas Instruments	传送最高带宽雷达脉冲的数据压缩方法 Beate Hoehne, Agilent Technologies	ETSI MIMO 无线设备监管测试系统 Brian Chi, Agilent Technologies	
08:50 - 09:10	S 波段卡塞格伦天线的双圆极化单脉冲跟踪反馈 Rajesh Chivukula, Larsen & Toubro	重新考虑 Y 因子噪声指数测量的不确定性计算 Guoquan Lu, Agilent Technologies	电源共模抑制的仿真与测量 Hongmei Fan, Cisco	宽带应用的 500 MHz 分析带宽，如针对卫星通信的雷达信号或多载波延迟测量的脉冲分析 Wolfgang Wendler, Rohde & Schwarz	双极化空间信道模型性能包括：遍历性、空间和时间特性 Hui Xiao, Spirent	

09:15 - 09:35	LTE 功能手持平板电脑的天线性能 Peter Futter, EMSS	Y 因子法和冷源法噪声系数测量之间的比较 Di Liu, Agilent Technologies	基于 FFT 的时域 EMI 测量：好处、挑战和 CISPR 辐射标准参考 Volker Janssen, Rohde & Schwarz	MIMO-OFDM 发射机 / Q 失配的测量 Ziquan Bai, Agilent Technologies	Agilent Forum: 宽带功率放大器设计和宽带 DPD 测量, Xiongbin Liao, Agilent Technologies	展览时间 10:00 - 15:00
09:35 - 09:55	对无线 LTE 设备性能增益至关重要的先进有源天线结构系统方法 Quanxin Wang, Ethertronics	0.3 至 67 GHz 的有效噪声提取算法和宽带噪声测量系统 Van-Hoang Nguyen, Focus Microwaves	实现先进抖动测量实用指南 Min Jie Chong, Agilent Technologies	高达 12 的相位相干信号创建 Beate Hoehne, Agilent Technologies	高频功率放大器的数字预失真测量, Jinbiao Xu, Agilent Technologies	
10:00 - 10:30	咖啡 / 茶歇					
	TH201	TH202	TH203	TH204	TH205	
10:35 - 10:55	电动小型卡塞格伦反射天线设计的创新方法 Ranadeep Saha, Larsen & Toubro	计算机中心脉冲创建和高功率射频器件表征的测量方法 Yong Liu, Philips	利用混合信号示波器的高速 DDR 内存调试和表征 Min Jie Chong, Agilent Technologies	近场通信概述和测量 Xiang Zhou, Rohde & Schwarz	针对下一代传统和最新相控阵雷达应用的减小尺寸和重量的 S 波段模块和托盘 Damian McCann, MACOM	
10:55 - 11:15	雷达应用的紧凑型 X 波段微带贴片天线设计 Manoj Dwivedi, Bharat Electronics	脉冲 IV/RF 测量技术和技巧 Qin Shen-Schultz, Auriga	多示波器测量系统与亚 ps 级的同步 Brig Asay, Agilent Technologies	NFC 器件模拟射频测试方法和体系结构 Dharmendra Lingaiah, National Instruments	混合域分析：在射频领域 Tektronix 的创新 Sun Yong, Tektronix	
11:20 - 11:40	阵列天线设计的新仿真方法 Hao Li, ANSYS	采用 ANSYS Multiphysics 的射频 / 微波平面器件的电热分析 Yong Yuan, ANSYS	自动多通路千兆位串行测试 Min Jie Chong, Agilent Technologies	FDD-LTE 无线电频谱发射模板分析和优化 Ming Huang, Nokia Solutions & Networks	准光学和自由空间毫米波和 THz 区材料测量的进展 Jon Martens, Anritsu	
11:40 - 12:00	EMScan	一个集成电热 MMIC/RFIC 设计流程 YuFu Li, AWR	真正差分驱动测量的不确定性与稳定性 Jon Martens, Anritsu	EMVco 和 ISO 10373-6 功率校准方法的比较 Feng Liu, VI Service	使用 Android 移动设备的 DC 至毫米波范围超小型高精度电源测量 Wei Dong, Rohde & Schwarz	
12:00 - 13:30	午餐休息					
	精选分组会议					
	WS_TH101	WS_TH102	WS_TH103	WS_TH104		
13:30 - 14:15	AWR EM 设计研讨会： RF 系统板的组合平面和 3D EM 仿真器：效果更好的技术 John Dunn, AWR	RF 半导体研讨会： 基于硅基技术的高性能 RF 和毫米波设计, Yuan Quan, MOSIS; 针对 LTE 基站放大器的 GaN HEMT 晶体管 Naiqian Zhang, Dynax	Rohde & Schwarz 研讨会： 采用 500 MHz 分析带宽和实时频谱分析的雷达信号分析 Wolfgang Wendler, Rohde & Schwarz	雷达仿真研讨会： 一种自动相控阵雷达校准解决方案 Ben Niu, Agilent Technologies ; 通用可重构体系结构设计雷达系统仿真 Cheng Wang, Agilent Technologies		
	PA_TH401	PA_TH402	PA_TH403			
14:15 - 15:00	EDA 设计流程分组会议： 参与公司：Agilent、ANSYS、AWR、CST、Sonnet 主持：David Vye, 微波杂志	半导体分组会议： 关注最终用途应用的 RF 半导体技术 参与公司：Freescale、OMMIC、Peregrine、TriQuint Semiconductor 主持：Zhancang Wang, Nokia Solutions & Networks	电信分组会议： 未来的电信系统趋势及其工程挑战 参与公司：Agilent、Spirent、R&S、Anritsu、NI 主持：Guangyi Liu, 中国移动研究院			